

ЭЛЕКТР МАЙДОНИДА ТУННЕЛЬ ДИОДИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ОРТИҚЧА ТОКНИНГ ВОЛЬТ-АМПЕР ХАРАКТЕРИСТИКАСИГА ТАЪСИРИ

Дадамирзаев Мухаммаджон Гуломкодирович,

Наманган муҳандислик - қурилиш институти

Ўқтамова Мунира Комилжон қизи

Ўзбекистон Миллий университети хузуридаги Яримўтказгичлар физикаси ва
микроэлектроника илмий-тадқиқот институти

E-mail: umk9391@gmail.com

Аннотация: Ушбу ишда туннель диодида ҳосил бўладиган ортиқча ток
Чайновет модели асосида тахлил қилиб чиқилди. Туннель диодидаги ортиқча
токнинг ўзгариши бўйича Франц-Кельдеш модели асосида электр майдоннинг
турли қийматларида туннел диодининг вольт-ампер характеристикиси олинди.
Тсу-Эсаки модельи асосида диффузион ток таъсирини ҳам ўрганилди.

Калит сўзлар: Чайновет модели, Тсу-Эсаки модели, барернинг
шаффоффлик коэффициенти, ортиқча ток, Франц-Кельдеш эфекти.

Туннель диодидаги ортиқча токни ҳисоблаш учун аниқ моделлар ишлаб
чиқилган. Моделлар қанча кўп бўлмасин асосан улардан туннель диодига ҳос
бўлган асосий учта зарурый сифатлар мавжуд бўлиши керак эди. Яъни
туннелланиш кучли бўлган чўққи токи, туннелланиш эҳтимоллиги минималь
бўлган дрейф токининг бошланишига мос келувчи токининг чуқурдаги энг
кичик қиймати ва дрейф токининг кучайиши билан боғлиқ бўлган токининг
кўпайиш режимига ўтишидир. Чайновет туннель диодидаги ортиқча ток
ифодаси $I_{CH} = D_K * P$ дан [1], шаффоффлик коэффициенти эса қуйидаги $P =$

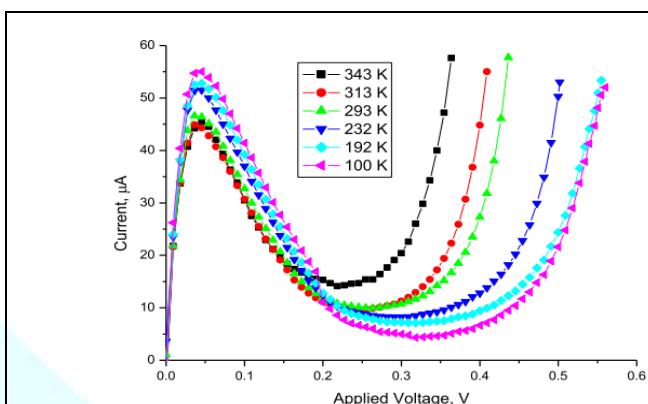
$\exp\left(-\frac{\alpha E_t^{\frac{3}{2}}}{F}\right)$ ифодадан фойдаланиб, бу ерда F-майдон кучланганлиги, $E_t = E_g - qV + \mu_n + \mu_p$; $\alpha = \theta \frac{4\sqrt{2m_e}}{3qh}$; $\theta \approx 1$ (θ -Чайновет моделининг ўзгармас параметри)

тенгликлардан қуидаги ифодага эга бўламиз[2]:

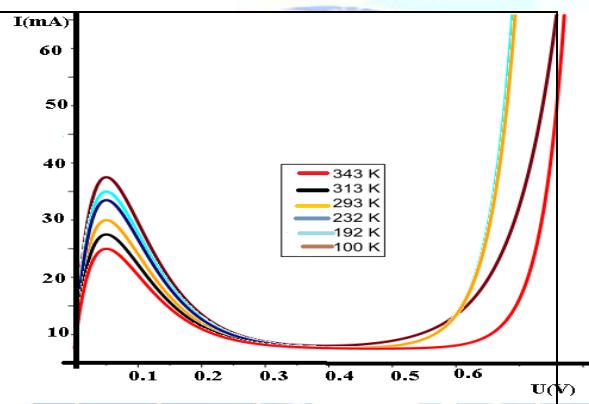
$$I = I_t + I_x + I_{\text{диф}} =$$

$$A \int_0^{\mu_n + \mu_p - qV} \exp\left(-\frac{\theta \frac{4\sqrt{2m_e}}{3qh} (E_g - qV + \mu_n + \mu_p)^{\frac{3}{2}}}{F}\right) \sqrt{\epsilon(\mu_n + \mu_p - \epsilon - qV)} * \left(\frac{1}{\exp(\frac{\epsilon - \mu_n}{kT})} - \frac{1}{\exp(\frac{\epsilon - \mu_n + qV}{kT}) + 1} \right) d\epsilon + D * \exp\left(-\frac{\alpha E_t^{\frac{3}{2}}}{F}\right) + I_0 \left(\exp\left(-\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right) \quad (1)$$

I_t -туннель токи, I_x – ортиқча ток, $I_{\text{диф}}$ – диффузия токи, бунда $P(F)$ ни ўзгарувчан ва ортиқча токни, диффузия токини ҳисобга олиб (1) ифодамиздан фойдаланган ҳолда электр майдонни ўзгармас бўлганда ҳароратнинг ортиши билан I_p –туннель токининг энг юқори нуқтасидаги қиймати ва диффузион токни ортишини 2-расмда кўришимиз ва 1-расмдаги тажриба графиги билан мослигини тахлил қилишимиз мумкин. Ортиқча ток ифодасидаги ҳолатлар зичлиги – D ни бирга тенг деб олдик.



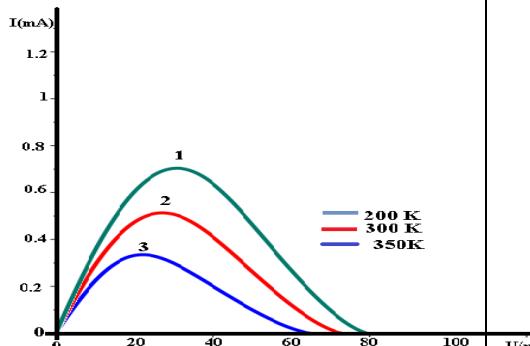
1-расм. BD4 Ge-асосли туннел диодида турли ҳароратлар учун олинган тажриба графиги [3]



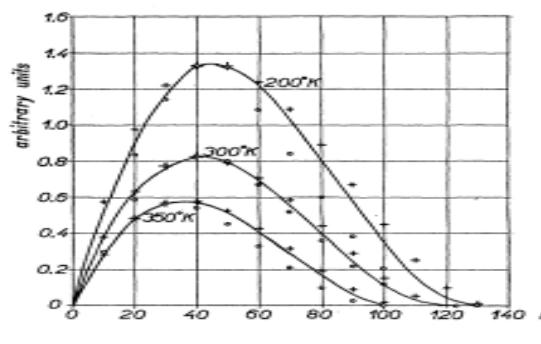
2-расм. (1) ифодага кўра туннел диоди ВАХси

$P(F)$ ни ўзгарувчан ва ортиқча токни хамда, диффузион токни ҳисобга олмаган ҳолда (1) ифодамиздан фойдаланиб электр майдонини ўзгарувчан бўлганда

хароратнинг ортиши билан I_p –туннель токининг энг юқори нуқтасидаги қиймати харорат ортиши билан камайишини 3-расмда кўришимиз мумкин.



3-расм. (1) ифодамиздан фойдаланган ҳолда туннель диоди учун турли электр майдонлари $F_1 = 2 * 10^4 \left(\frac{V}{m} \right)$, $F_2 = 2.5 * 10^4 \left(\frac{V}{m} \right)$, $F_3 = 2.8 * 10^4 \left(\frac{V}{m} \right)$ олинган ВАХ си. Бунда ортиқча ток ва диффузион токни ҳисобга олмаймиз



4-расм. Карловский модели асосида олинган туннель диодининг вольт-ампер характеристикаси [4]

Хулоса

Чайновет моделида ортиқча ток ифодаси P га тўғри пропорционал бўлганлиги учун унинг ВАХси электр майдон зичлигига (E) га боғлиқ равишда ўзгаради [5,7]. Бу ерда ортиқча ток деярли сезилмаган, диффузия токи ҳароратга боғлиқ равишда ортиқча токга нисбатан устунлик қиласди. Демак, тажрибаларда олинган туннель диодида ҳосил бўладиган токни баҳолаш учун бошқа моделлерга нисбатан Франц-Кельдеш эффекти асосида кўрилган Чайновез модели бўйича юқори аниқликда текшириш мумкинлиги кўрсатилди.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР

1. A.G.Chynoweth, W.L.Feldman and R.A.Logan,**Phys. Rev. 121,684 (1961).**
2. N. Moulin, Mohamed Amara, F. Mandorlo, M. Lemiti. Tunnel junction I (V) characteristics: Review and a new model for p-n homojunctions. Journal of Applied

Physics, American Institute of Physics, 2019, 126 (3), pp.033105.
ff10.1063/1.5104314ff. fffal-03035269ff

3.W. Abd El-Basit, Z.I.M. Awad, S.A. Kamh, F.A.S. Soliman
Electronic Research Lab., Physics Dept., Faculty of Women for Arts, Science, and
Education, Ain-shams University, Cairo, Egypt0
Nuclear Materials Authority, P. O. Box 530, Maadi, 11728, Cairo, Egypt Temperature
dependence of backward tunnel diode oscillator circuit.

4. Jaroslav Karlovsky. Simple Method for Calculating the Tunneling Current of an Esaki Diode. Popov Research Institute of Radio Communications, Praha, Czechoslovakia (Received January 3, 1962).

5. Yury Turkulets and Ilan Shalish. Franz-Keldysh effect in semiconductor built-in fields. 22 April 2018

6. T.A.De Massa and D.P.Knott, **Solid-St. Electron. 13,131(1970)**.

7. Tyler A. Growden, Evan M. Cornuelle, David F. Storm, Weidong Zhang, Elliott R. Brown, Logan M. Whitaker, Jeffrey W. Daulton, Richard Molnar, David J. Meyer and Paul R. Berger. 930 kA/cm² peak tunneling current density in GaN/AlN resonant tunneling diodes grown on MOCVD GaN-on-sapphire template. Cite as: Appl. Phys. Lett. 114, 203503 (2019); [doi:10.1063/1.5095056](https://doi.org/10.1063/1.5095056).